

最新オンウェハー計測技術の紹介
－オンウェハー全自動 RF 測定システム－

Introduction of recent on-wafer technologies
－Autonomous RF Measurement Assistant－

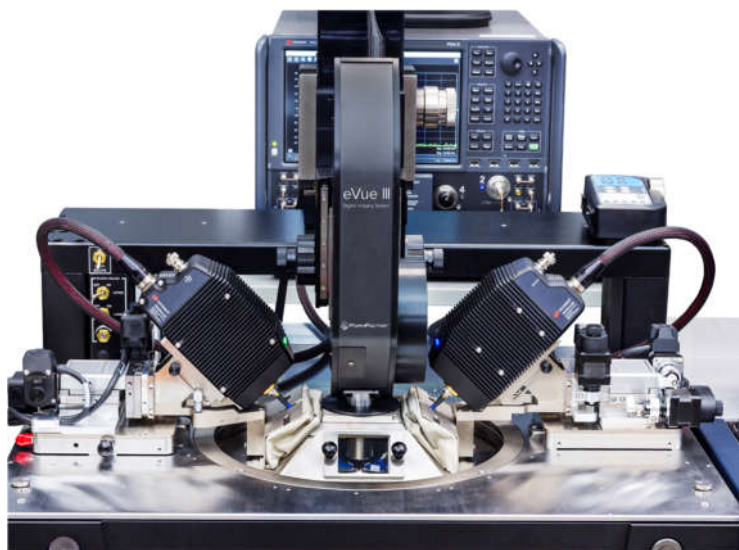
菅原 徹†

Toru Sugawara†

†フォームファクター株式会社 アプリケーションエンジニアリング
FormFactor K.K. Application Engineering

概要

デバイスモデリングに必要な RF 測定は、常温だけではなく広い温度範囲での測定が要求されます。従来このような温調測定は経験を積んだエンジニアがシステムの安定度等を判断しながら行ってきました。今回紹介させていただきます「オンウェハー全自動 RF 測定システム」では電動ポジショナー、デジタル顕微鏡、専用ソフトウェアによりこれらの操作を全自動で行うことで、モデリングに必要なデータを取得することが可能となります。



Abstract

Device Modeling requires Over-Temperature RF Measurements which require experience and deep understanding of over-temperature behavior of Measurement System. New Autonomous RF Measurement System enables Hand-Free Over-Temperature Measurement by using Motorized Positioner, Digital Microscope and Dedicated Software.